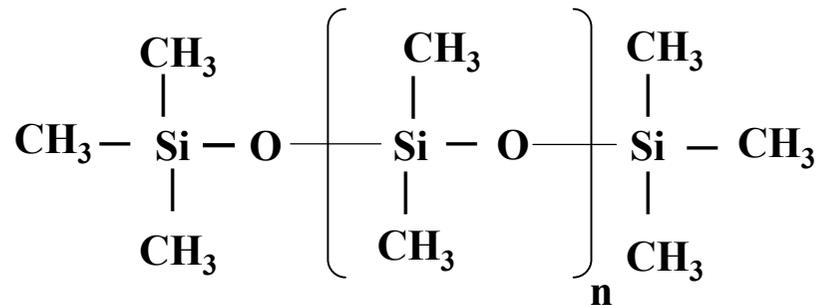
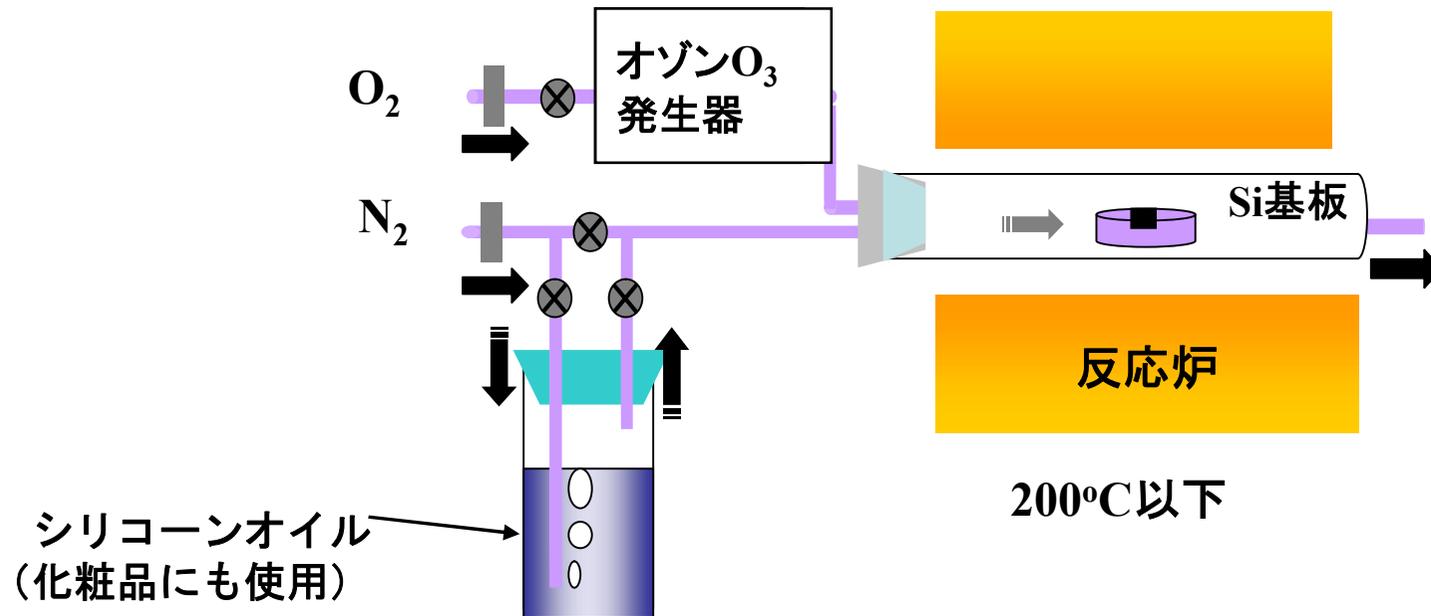
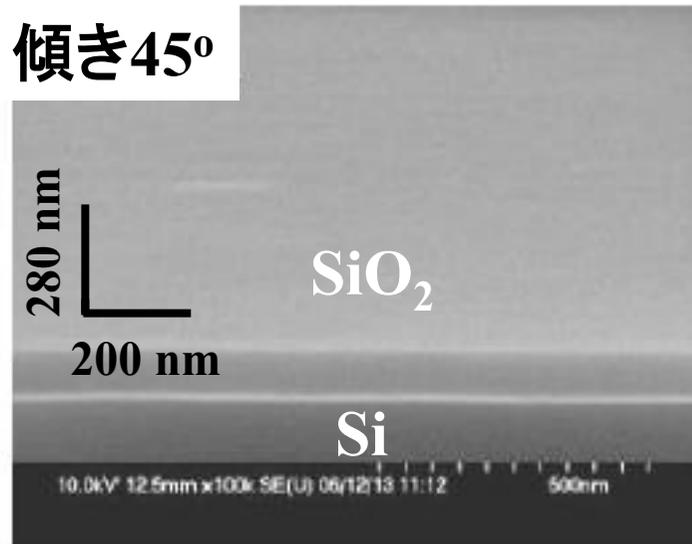


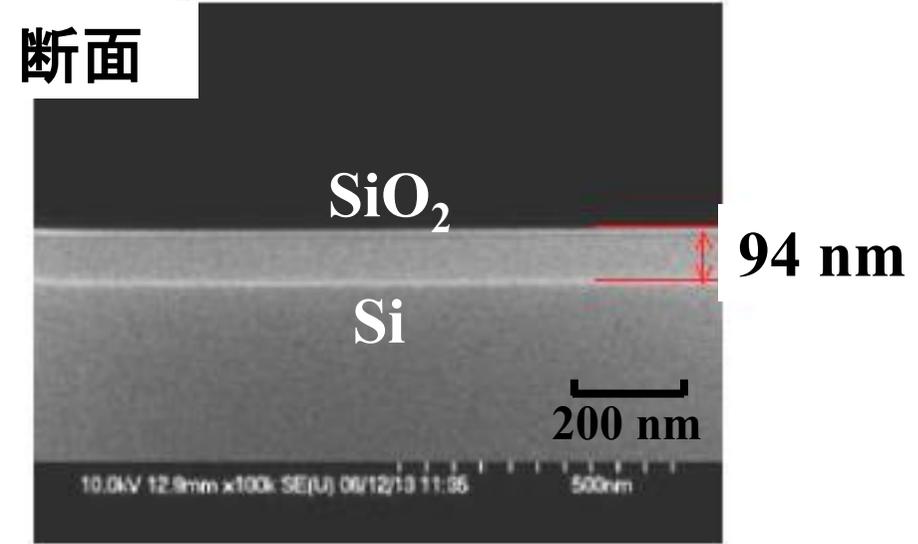
1-b) シリコンオイルとオゾンを用いた酸化Si薄膜の低温作製



200°C形成した酸化Si薄膜の走査型電子顕微鏡像



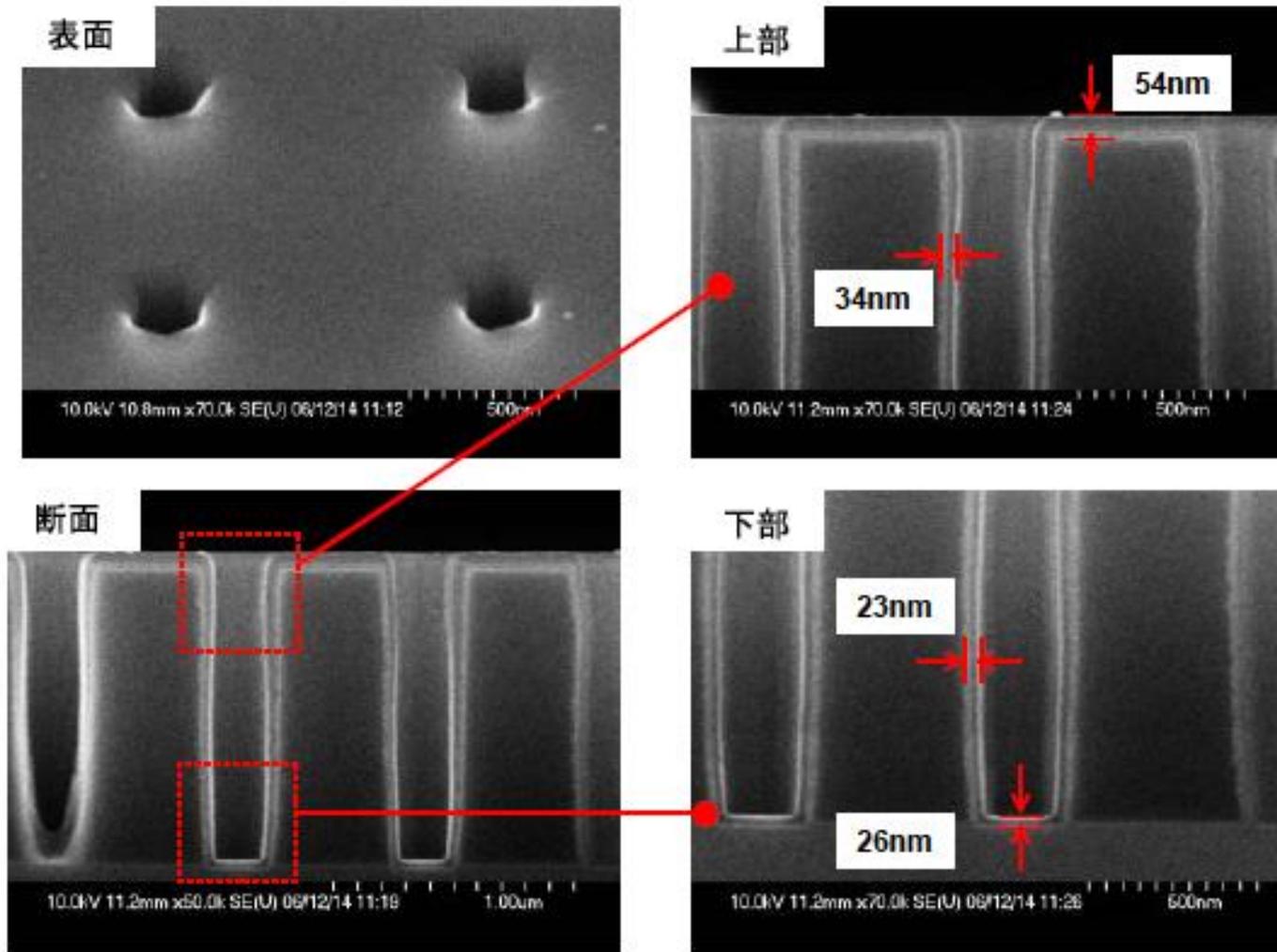
斜め上からの試料表面



試料断面

現在：低温作製だと、絶縁性を悪くする水分が含まれるため、その除去方法を検討中。

200°Cで堆積した酸化Si膜のSEM像



アスペクト比= ~ 4.4 、幅300nm、深さ1300nm、間隔425nm